

KONFERENCJA NAUKOWA

Tendencje rozwoju metrologii i aparatury naukowej

27 maja 2010 r.

Politechnika Koszalińska

ul. Śniadeckich 2, budynek A, sala Senatu, V piętro. godz. 10:00

Program

10:00 Rejestracja uczestników

10:30 Powitanie uczestników konferencji, w tym członków Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN i zaproszonych gości, przez JM Rektora Politechniki Koszalińskiej, prof. dr. hab. inż. Tomasza Krzyżyńskiego

**Sesja plenarna prezentująca wybrane kierunki badań,
w zakresie metrologii i aparatury naukowej, prowadzone
w Politechnice Koszalińskiej:**

11:00 Wybrane problemy w pomiarach nierówności, ocenie chropowatości i klasyfikacji topografii powierzchni na podstawie ich cech stereometrycznych
– prof. dr. hab. inż. Wojciech Kacalak

11:30 Wybrane problemy pomiaru parametrów cieplnych struktur elektronicznych
– prof. dr. hab. inż. Włodzimierz Janke,
– prof. nadzw. dr. hab. inż. Zbigniew Suszyński

12:00 7. Program Ramowy UE jako źródło finansowania badań
– mgr Maria Pelc.

12:15 Dyskusja

12:30 Zwiedzanie wybranych laboratoriów Wydziału Elektroniki i Informatyki, Wydziału Mechanicznego oraz Instytutu Mechatroniki Nanotechnologii i Techniki Próźniowej

13:45 Wyjazd członków KMian z Koszalina do Darłówka



Konferencja dofinansowana jest z budżetu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Organizatorem konferencji jest Politechnika Koszalińska: Wydział Mechaniczny oraz Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE.